

報道関係 各位

株式会社アドバンテスト

メモリ・テスト・システム「T5831」を発表

モバイル機器用 NAND フラッシュ・メモリ、NAND ベース MCP 向けテスト・システム

高い生産性と低いテスト・コストを兼ね備える、拡張可能なモジュラー設計

株式会社アドバンテスト(本社:東京都千代田区 社長:松野晴夫)は、モバイル機器で使用される次世代 NAND フラッシュ・メモリの試験向けに、メモリ・テスト・システム「T5831」の出荷を開始しました。eMMC(embedded Multi-Media Card)などのフラッシュ・メモリ搭載デバイスや、ONFi/Toggleの両インタフェースに対応するほか、MCP(Multi-Chip Package)に搭載された NAND フラッシュ・メモリと DRAM のコンカレント・テストもサポートします。

「T5831」は、多数個のデバイスを同時にテストすることで、テスト・コストの低減を実現します。お客様の今日のテスト・ニーズに応える業界トップクラスの経済効率と、投資効率を将来にわたって最大化するシステム拡張性を備えています。同時に発表したエンジニアリング向けシステム「T5831ES」は、テスト・プログラムの開発やデバイスの特性評価に最適で、お客様の製品のタイム・トゥ・マーケットに貢献します。



メモリ・テスト・システム「T5831ES」

「T5831」には、業界トップクラスのテストタイムを実現する多くの特長が盛り込まれています。

- ・「Tester-Per-Site[™]」構造と業界トップクラスの電流を供給可能なデバイス電源により、プログラムおよび消去動作を高速化し、高いスループットを可能にします。



株式会社 **アドバンテスト**

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6番2号
新丸の内センタービルディング
TEL: 03-3214-7500

-
- ・システムのハードウェアは、誤り訂正符号(ECC)のオンザフライ解析を可能とし、ポスト処理に伴う余分なテストタイムを取り除くことができます。
 - ・リアルタイムでのソース・シンクロナス機能で、従来のポスト処理方法と比べより高いスループットと歩留まりを得ることができます。「プロセス/電圧/温度(PVT)」のばらつきに起因するタイミングのずれを cycle by cycle で自動調整し、高速かつ高い歩留まりに欠かせない測定精度を約束します。

この他にも、「バッド・ブロック・マネジメント」、冗長性解析、カスタム/ランダムデータ生成などの機能も備えた「T5831」は、NANDフラッシュ・メモリのテストに最適なシステムです。

アドバンテストのメモリ・テスト・システムは、世界各地に8,000台以上設置され、メモリ・デバイス試験の市場をリードしています。これに「T5831」が加わることにより、市場における当社のプレゼンスがさらに高まることが期待されます。